36	arcii i	Anrea	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/711,686	FREDETTE ET AL.
Examiner	Art Unit

Christopher W. Fulton

2859

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
033	544 542 544.2 544.3 555.1 555.4	11/3/2005	CWF	
			,	
	. •			

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
		1	
		:	

(INCLUDING SEARCH	STRATEGY	<u>') </u>
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
		-
•		
·		
		-